

SER 航太商用體驗營

半導體在受益於摩爾定律下日新月異，但伴隨著先進製程將電晶體 (transistors) 電壓不斷優化和縮小來自環境、材料和封裝的遊離輻射對電子器件的影響已成為可靠性應用必須考慮的挑戰。商用規範如 ISO26262 和 AEC-Q100 或航太規範如 JESD57 和 JESD234 都對遊離輻射造成的失效和測試列出了準則。此體驗營為台灣唯一公開透過實際加速輻射測試來現場觀測輻射對半導體器件的影響，瞭解測試規劃，和破除一般工程師對器件和失效的關聯性之迷思。

課程大綱

設施介紹(NARI 提供)	Proton Test plan mock draft
測試架設介紹	Proton Test plan review
Beam Room Setup (一批次4~6位)	(Time permits) TID Test plan mock draft
Data Room Setup (一批次3位)	(Time permits) TID Test plan review
SR1 & SR4 Overview	

特色效益

- ▶ 協助學員瞭解輻射對先進製程半導體影響
- ▶ 協助學員瞭解相關車用或航太規範在軟失效(輻射)之要求
- ▶ 協助學員瞭解基於實際觀察到的失效和純理論失效之差異 - 商用規範之迷思

報名對象

- ▶ 航太工程師
- ▶ 可靠性工程師 (車用/伺服器/數據中心/通訊)

講師介紹

- ▶ SGS 功能安全專家 鄭振維 技術經理

訓練時程及地點

訓練日期 | 2025/9/12(五)

訓練時間 | 上午場次：8:50a.m.~ 12:00p.m.
下午場次：12:50p.m.~ 4:00p.m.

訓練地點 | 國家原子能科技研究院：325桃園市龍潭區文化路1000號

注意事項 | 請自備可運作之筆電，以配合課程進行。

訓練費用

- ▶ 課程費用每位 NT 25,000元/未稅。
- ▶ 課程結束後，將提供上課證明予完成問卷者。



立即掃描 QR Code 進行線上報名！

聯絡窗口 台灣檢驗科技股份有限公司 - 功能安全暨資通安全服務中心
Tel: 02-2299-3279 #3661 E-mail: tw.fs@sgs.com

Agenda

上午時程 / 下午時程	主題	講師
8:30-8:50 / 12:30-12:50	報到時間	
8:50-9:00 / 12:50-13:00	參與學員統一進入測試設施	SGS 功能安全專家 鄭振維 經理
9:00-9:30 / 13:00-13:30	測試設施介紹	國原院 李灝銘 博士
9:30-10:30 / 13:30-14:30	測試平台、被測物介紹 - 測試計劃、測試流程、簡介 - 被測物於輻射影響下之失效模式預測 - 結合 ISO 26262 FMEDA 計算, AEC-Q100 需求	SGS 功能安全專家 鄭振維 經理
10:30-11:00 / 14:30-15:00	實驗室(Beam Room)介紹 測試平台和被測物架設	國原院 李灝銘 博士 SGS 功能安全專家 鄭振維 經理
11:00-11:30 / 15:00-15:30	控制室(Data Room)介紹 測試平台架設 加速輻射測試 數據收集	SGS 功能安全專家 鄭振維 經理
11:30-12:00 / 15:30-16:00	Q&A	SGS 功能安全專家 鄭振維 經理

個人資料相關事項

- 一、主辦/協辦單位不會將您個人資料傳輸給第三方，且將遵循以下原則於國內使用您個人資料：
 1. 使用於本活動與後續相關事項。
 2. 使用於主辦單位之活動訊息發送。
 3. 使用於執行單位之電子報發送。
- 二、若您於課程/活動結束後希望 SGS 刪除您此次報名資料，您可以另行以郵件通知：tw.fs@sgs.com。
- 三、SGS 保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

SGS

When you need to be sure